МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Лабораторная работа №4.3.1 Излучение дифракционного света

> Работу выполнил Лохматов Арсений Игоревич Б03-303



1 Теоретическая часть

Цель работы: исследовать явление дифракции Фринеля и Фраунгофера на одной и двух щелях, изучить дифракции на разрешающую способность оптических инструментов; проверить теоретические соотношения для положения максимумов при дифрауции Френеля и Фраунгофера.

Оборудование: оптическая скамья, ртутная лампа, светофильтр, щели с регулируемой ши риной, рамка с вертикальной нитью, экран с двойной щелью, микроскоп на поперечных салазках с микрометрическим винтом, зрительная труба.

Схема установки для наблюдения дифракции Френеля представлена на рисунке 1. Свет от ртутной лампы Π , пропущенной через оранжевый светофильтр Φ со средней длиной волны $\lambda = 578$ нм, падает на входную щель S_1 . Щель S_1 находится в фокусе коллиматора - собирающей линзы O_1 . Коллиматор создаёт параллельный пучок монохроматического света, освещающий щель S_2 , на которой и происходит дифракция. Дифракционная картина рассматривается с помощью микроскопа M, сфокусированного на некоторую плоскость наблюдения Π .

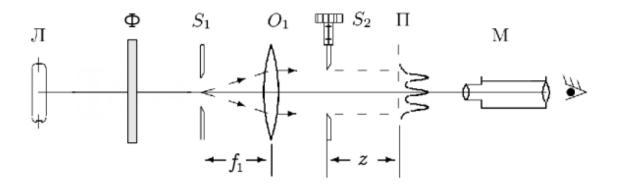


Рис. 1: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля

Распределение интенсивности света в плоскости наблюдения Π проще всего рассчитывать с помощью зон Френеля (для щели их так же называют зонами Шустера). При освещении щели S_2 параллельным пучком лучей (плоская волна) зоны Френеля представляют собой полоски, параллельные краям щели (рисунок 2).

Результирующая амплитуда в точке наблюдения определяется суперпозицией колебаний от тех зон Френеля, которые не перекрыты створками щели. Границы зон Френеля/Шустера ξ_m определяются соотношением

$$\xi_m = \pm \sqrt{mz\lambda}, \ m \in \mathbb{N},$$

где ξ отсчитывается от центра щели, z - расстояние от центра щели до плоскости наблюдения Π , а λ - длина волны. При ширине щели b $(-b/2 < \xi < b/2)$ полное число открытых зон для точки наблюдения на оси равно

$$m = \frac{b^2}{4\lambda z}.$$

По определению, разделение волнового фронта на зоны Френеля производится так, чтобы излучение от соседних зон находилось в противофазе. Иными словами, разность хода (от поверхности фронта до точки наблюдения) между краями соседних зон равна $\lambda/2$. Поэтому,

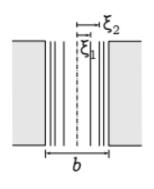


Рис. 2: Зоны Шустерав плоскости щели

когда открыто чётное число зон Френеля, на оси системы наблюдается минимум дифракционной картины (тёмная полоса). Если число открытых зон нечётно, в центре картины - максимум (светлая полоса).

Зафиксируем размер щели b и проанализируем, как меняется картина в зависимости от расстояния до плоскости наблюдения z. Если чило открытых зон Френеля велико, $m\gg 1(z\to 0)$, мы приходим к пределу геометрической оптики. В нём дифракционная картина отсутствует, а размер изображения щели совпадает с шириной самой щели b. Дифракционная картина наблюдается только в узкой полосе вблюзи границ щели (дифракция на краю экрана). При удалении от плоскости геометрического изображения эти две группы полос постепенно расширяются, заполняя всё изображение щелию При $m\sim 1$ на щели наблюдается сложная картина из небольшого числа дифракционных полос. При дальнейшем удалении ($m\ll 1,\ z\to \infty$) дифракционная картина начинается упрощаться и расширяться, переходя в

режим Фраунгофера - затухающие по интенсивности эквидистантные полосы с характерным угловым размером центральной полосы λ/b .

Амплитуду света в произвольной точке плоскости наблюдения можно определить графически с помощью векторной диаграммы - спирали Корню.

Распределение амплитуд в режиме дифракции Френеля $(m \sim 1)$ довольно сложное. Однако если число открытых зон Френеля больше единицы и близко к целому (m = 2.3...), то в картине можно довольно чётко выделить m-1 тёмных полос, заполняющих изображение щели. Так можно по виду дифракционной картины оценить число зон Френеля на полуширине щели.

2 Практическая чать

2.1 Дифракция Френеля

Предлагается исследовать дифракцию Френеля на узкой щели, на краю экрана, на тонкой нити.

- 1. Подготовили приборы к работе:
 - (а) настроили зрительную трубу на бесконечность;
 - (b) определили нуль микрометрического винта щели S_2 . Получили $b_0 \approx (54.0 \pm 1.0)$ мкм;
 - (с) собрали схему согласно рисунку 1;
 - (d) проверили, что при небольшом удалении микроскопа от щели на ярком фоне геометрического изображения щели появляются узкие тёмные дифракционные полосы, количество которых уменьшается по мере удаления микроскопа;
 - (е) Улучшили контрастность картины.
- 2. Добившись наибольшей чёткости и контрастности дифракционной картины, снова нашли резкое изображение щели. Начальное положение микроскопа составляет $l=(68.2\pm0.1)$ см..
- 3. Постепенно отодвигая микроскоп от щели S_2 , замеряем по шкале положение микроскопа, при котором на фоне щели видна одна тёмная полоса (n=1). Смещение микроскопа от первоначального положения даёт величину z расстояние от щели до плоскости наблюдения (m=n+1).
- 4. Приближая микроскоп к щели, измеряем зависимость координаты микроскопа z от числа n наблюдаемых минимумов. Результаты измерений представлены в таблице 1.

| n | n = 0 | | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|--|
| m | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| l, cm | 68.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 65.5 | 64.5 | |
| z, cm | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | |

Таблица 1: Результаты измерений

5. Измерим ширину b щели S_2 . Учитывая начальную толщину щели b_0 , получили $b \approx (402.0 \pm 1.0)$ мкм.

6. Качественные наблюдения:

- (а) При небольшом удалении микроскопа от щели у её краёв появляются узкие частые полосы. Это дифракция на краю экрана. Возле границы располагалась самая яркая светлая полоса.
- (b) для исследования дифракции Френеля на препятствии мы поставили вместо щели S_2 рамку с тонкой вертикальной нитью. Настроили микроскоп на резкое изображение нити. Наблюдаем характерную светлую полосу посередине.

7. Обработка результатов:

(а) Подобрали координаты так, чтобы зависимость расстояния до щели z от числа открытых зон Френеля m была линейной.Построили график зависимости и с помощью аппроксимации убедились в том, что экспериментальные точки лежат на одной прямой. График представлен на рисунке 3.

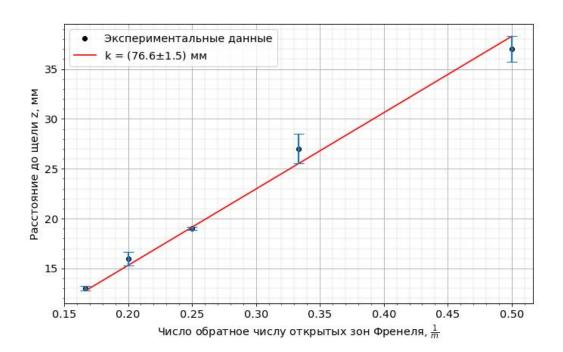


Рис. 3: График зависимости $z\left(\frac{1}{m}\right)$

По наклону прямой определим ширину щели b.

$$y=z; \ x=\frac{1}{m}; \ m=\frac{b^2}{4\lambda z} \Longrightarrow y=\frac{b^2}{4\lambda} x \Longrightarrow k=\frac{b^2}{4\lambda} \Leftrightarrow b=2\sqrt{k\lambda},$$

где
$$\lambda = 58 \cdot 10^{-5}$$
 мм - длина волны жёлтого света.

$$b = 2\sqrt{76.551 \cdot 58 \cdot 10^{-5}} = 0.420$$
 mm.

$$\sigma_b = b\sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} \Longrightarrow \sigma_b = 0.420 \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{1.493}{76.552}\right)^2} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mm}, \ \varepsilon = 0.97\%).$$

$$b = (420 \pm 4) \text{ MKM}, \ (\varepsilon = 0.97\%)$$

(b) Сравнили результат с прямым измерением по микрометрическому винту. Отклонение состовляет $\Delta = \frac{420-402}{402} \cdot 100\% \approx 4\%$.

2.2 Дифракция Фраунгофера на щели

На значительном удалении от щели, когда выполнено условие $m \ll 1$ (то есть ширина щели становится значительно меньше ширины первой зоны Френеля $b = \sqrt{\lambda z}$), изображение щели размывается и возникает дифракционная картина, называемая дифракцией Фраунгофера.

Дифракцию Фраунгофера можно наблюдать на той же установке, что и дифракцию Френеля (1). Однако при обычных размерах установки дифракцию Фраунгофера возникает только при очень узких щелях. Поскольку работать с тонкими щелями неудобно, для наблюдения дифракции Фраунгофера к схеме добавляется объектив O_2 (4).

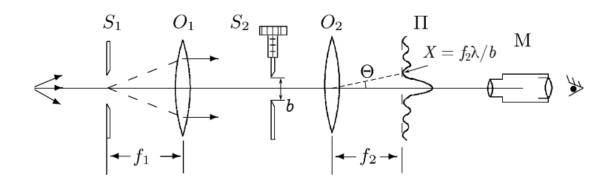


Рис. 4: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели

Дифракционная картина наблюдается в фокальной плоскости объектива O_2 . Поскольку объектив не вносит дополнительной разности хода между интерферирующими лучами (таутохронизм тонкой линзы), в его фольной плоскости наблюдается неискажённая дифракционная картина Фраунгофера, соответствующая бесконечно удалённой плоскости наблюдения.

При дифракции Фраунгофера в центре поля зрения наблюдается дифракционный максимум (светлая полоса). Сбоку от неё наблюдается чередующиеся минимумы и максимумы с довольно быстро затухающей интенсивностью. Направление на минимумы (тёмные полосы) при малых углах Θ определяется соотношением

$$\Theta_n^{min} = n \frac{\lambda}{b}, \ n = \pm 1, \pm 2, ...,$$

где b - ширина щели. Каждому значению угла Θ соответствует точка в плоскости объектива с фокусным расстоянием f_2 , отстоящая от оптической оси на расстоянии

$$X_n = f_2 t g \Theta_n \approx f_2 \Theta_n.$$

Измеряя зависимость X от m или расстояние между полосами ΔX , можно определить ширину щели S_2 .

1. Настроили установку:

- (a) не разбирая схемы из предыдущего управжения, добавили к ней линзу O_2 (см. рисунок 4);
- (b) настроили микроскоп на фокальную плоскость П линзы, закрепили его на скамье;
- (c) подобрали ширину щели S_2 так, чтобы в поле зрения микроскопа появилась дифракционная картина;
- (d) изменили ширину входной щели S_1 , добившись нвибольшей контрастности картины.

2. Провели измерения:

(a) С помощью окулярной шкалы микроскопа измерили координаты x_m нескольких дифракционных минимумов в обе стороны от центра. Измерения проводили по нижней шкале, цена деления которой составляет $\sigma_x = 0.04$ мм. Результаты измерений представлены в таблице 2.

| n | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| x_m | 1.44 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.8 | 1.92 | 2.0 | 2.08 | 2.16 | 2.28 | 2.36 | 2.48 |

Таблица 2: Результаты измерений

- (b) Записали ширину b щели S_2 и фокусное расстояние f_2 линзы O_2 . Учитывая ноль микрометрического винта, получили, что $b = (443.5 \pm 1.0)$ мкм, $f_2 = 9$ см.
- 3. Провели качественные наблюдения. Можно заметить, что:
 - (a) смещение щели S_2 в боковом направлениине приводит к сдвигу дифракционной картины. Этот эффект может быть не сильно заметем, если система отцентрирована не точно;
 - (b) при уменьшении ширины b щели S_2 дифракционная картина растягивается.

4. Обработали результаты:

- (a) Построили график зависимости положения x_m экстремумов дифракционной картины от их номера m. Результат представлен на рисунке 5. Видно, что зависимость может быть аппроксимирована прямой линией.
- (b) По наклону прямой определим ширину щели b. Оценим погрешность результата.

$$y=x_m;\;x=m;\;x_m=f_2\frac{\lambda}{b}m\Longrightarrow y=f_2\frac{\lambda}{b}x\Longrightarrow k=f_2\frac{\lambda}{b}\Leftrightarrow b=\frac{f_2\lambda}{k},$$
 где $\lambda=58\cdot 10^{-5}$ мм - длина волны жёлтого света.
$$b=\frac{90\cdot 58\cdot 10^{-5}}{0.093}=0.561 \text{ мм}.$$
 $\sigma_b=b\sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{\sigma_k}{k}\right)^2}\Longrightarrow \sigma_b=0.561\cdot\sqrt{\left(\frac{1}{2}\frac{0.001}{0.093}\right)^2}=3\cdot 10^{-3}$ мм, $(\varepsilon=0.54\%).$ $b=(561\pm 3)$ мкм, $(\varepsilon=0.54\%)$

(c) Сравнили результат с прямым измерением по микрометрическому винту. Отклонение состовляет $\Delta=\frac{561-498}{498}\cdot 100\%\approx 12\%.$

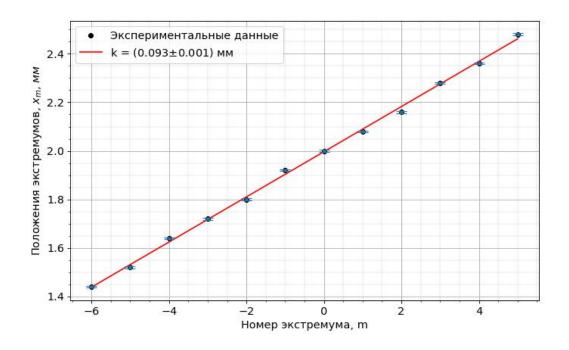


Рис. 5: График зависимости $x_m(m)$

2.3 Дифракция Фраунгофера на двух щелях

Схема для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях изображена на рисунке 6. По сравнению с рисунком 4 в ней щель S_2 заменена на экран \Im с двумя щелями. При этом щель S_2 (с микрометрическим винтом) установлена вместо входной щели S_1 (для измерения влияния ширины источника на чёткость картины).

Результат дифракции на двух щелях можно представить как интерференцию дифракционных картин от каждой щели.

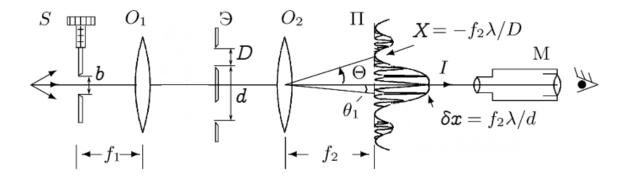


Рис. 6: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на двух щелях

Если входная щель достаточно узка, то дифракционная картина в плоскости Π (рисунок 6) подобна той, что получалась при дифракции на одной щели, однако теперь вся картина испещрена рядом дополнительных узких полос. Наличие этих полос объясняется суперпозицией (интерференцией) световых волн, приходящих в плоскость наблюдения через разные щели экрана Θ . В центре главного дифракционного максимума располагается светлая полоса (разность на оси, в силу симметрии, равна нулю). Светлая интерференционная полоса наблюдается также, когда разность хода кратна длине волны. Угловая координата Θ _n интерференционного

$$\Theta_n d = n\lambda, \ n = \pm 1, \pm 2, ...,$$

где d - расстояние между щелями. Линейное расстояние δx между соседними интерференционными полосами в плоскости Π равно

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d}.$$

На рисунке 6 показано распределение интенсивности в фокальной плоскости объектива O_2 . Штриховой линией изображено распределение интенсивности при дифракции света на одиночной щели. Поскольку полная угловая ширина главного дифракционного максимума (от минимума до минимума) равна $2\lambda/D$, где D - ширина отдельной щели, то на нём укладывается $N=\frac{2d}{D}$ тёмных интерференционных полос (в центре картины максимум, поэтому светлых полос - на одну больше).

При дифракции света на двух щелях чёткая система интерференционных полос наблюдается только при достаточно узкой ширине входной щели S_2 , которую можно рассматривать как протяжённый источник света размером b. Для наблюдения интерференции необходимо, чтобы расстояние d между щелями не превышало радиуса когерентности:

$$d \le \rho_{\text{kor}} \approx \frac{\lambda}{b} f_1.$$

Таким образом, по рамытию интерференционной картины можно оценить размер источника *b*. Этот метод используется в звёздном интерферометре при изменении угловых размеров звёзд.

1. Подготовили установку:

- (a) Не перемещая линз и микроскопа в установке, убрали входную щель S_1 и на её место установили щель с микрометрическим винтом S_2 . Слегка передвигая щель S_2 вдоль скамьи, нашли в микроскопе резкое изображение новой входной щели. Закрепили шель.
- (b) Между линзами поставили экран Э с двойной щелью. В области главного дифракционного максимума появилась система равноотстоящих тёмных и светлых полос (рисунок 6). Центрировкой системы и подбором ширины входной щели добились наибольшей чёткости дифракционной картины.

2. Измерения:

- (a) Подсчитали число тёмных интерференционных полос в пределах главного (центрального) дифракционного максимума: N=10.
- (b) Измерили расстояние δx между минимумами интерференционной картины: $\delta x = \frac{0.2}{9} = (0.022 \pm 0.002)$ мм.
- (c) Исследовали влияние размера источника на контрастность интерференционной картины. Для этого, расширяя входную щель S, подобрали такую её ширину $b_0 = 25.5$ мкм, при которой наступает первое исчезновение интерференционных полос.
- (d) При дальнейшем увеличении входной щели картина вновь появляется, но заметно менее контрастна. Соответствующая ширина входной щели равна $b_1 = (36.5 \pm 3)$ мкм.
- (e) Фокусные расстояния линз равны $f_1 = 12.5$ см, $f_2 = 9$ см.
- (f) С помощью микроскопа измерили ширину двойных щелей D и расстояние между ними. Для этого поставили двойную щель непосредственно перед микроскопом:

$$D_{11} = 79 \cdot 0.04 = 3.16 \text{ mm}, D_{12} = 92 \cdot 0.04 = 3.68 \text{ mm}, \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_1 = |D_{11} - D_{12}| = (0.52 \pm 0.02)$$
 мм — ширина первой щели; $D_{21} = 155 \cdot 0.04 = 6.2$ мм, $D_{22} = 162 \cdot 0.04 = 6.48$ мм, \Rightarrow $\Rightarrow D_2 = |D_{21} - D_{22}| = (0.28 \pm 0.02)$ мм — ширина второй щели. $d = D_{21} - D_{12} = (2.52 \pm 0.04)$ мм.

- 3. Обработали результаты:
 - (a) По расстоянию δx между полосами, рассчитали расстояние между щелями d:

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d} \Leftrightarrow d = f_2 \frac{\lambda}{\delta x} \Longrightarrow d = 90 \cdot \frac{58 \cdot 10^{-5}}{0.022} = (2.37 \pm 0.21) \text{ MM}.$$

Полученное значение совпадает по порядку с измеренным. Отклонение составляет $\Delta = \frac{2.52-2.37}{2.52} \cdot 100\% \approx 6\%.$

(b) Сравнили наблюдаемое число полос в главном максимуме с теоретическим:

$$N_1^{theor} = \frac{2d}{D_1} = \left[\frac{2 \cdot 2.37}{0.52} \right] = 9, \ N_2^{theor} = \frac{2d}{D_2} = \left[\frac{2 \cdot 2.37}{0.28} \right] = 16.$$

Измеренное число наблюдаемых полос в главном максимуме лежит в диапазоне полученных значений для каждой щели в отдельности. Более точно мы не можем сравнить, так как на это влияет юстировка системы, то есть какая щель даёт больший вклад.

(c) Сравнили измеренную ширину b_0 входной щели S с теоретическим расчётом:

$$d \le \rho_{\text{KOT}} \approx \frac{\lambda}{b_0} f_1 \iff 2.52 \le \frac{28 \cdot 10^{-5}}{25.5 \cdot 10^{-3}} \cdot 125 = 2.84 - \text{верно!}$$

(d) Рассчитаем ширину b_1 , при котором изображение должно опять появиться. Для этого рассмотрим предельный случай:

$$d = \frac{\lambda}{b_1} f_1 \iff b_1 = \frac{\lambda}{d} f_1 \implies b_1 = \frac{58 \cdot 10^{-5}}{2.52} \cdot 125 = 28.8 \cdot 10^{-3} \text{ MM}.$$

Полученное значение совпадает по порядку величины с измеренным.

3 Подведение итогов и выводы

В данной лабораторной работе мы исследовали явление дифракции Фринеля и Фраунгофера на одной и двух щелях, проверили теоретические соотношения для положения максимумов при дифрауции Френеля и Фраунгофера.

В ходе работы мы научились юстировать сложные оптические системы, работать с линзами и дифракционными щелями, фильтром света.

Исследовали зависимость расстояния до щели z от числа открытых зон Френеля m (рисунок 3), с помощью графика определили размер щели b; исследовали зависимость положения экстремумов x_m от их номера m (рисунок 5), с помощью графика определили размер щели b.

Полученные значения совпадают по порядку величины с теоретическими, и во всяком случае не противоречат здравому смыслу. Отклонения могут быть связаны с неточной юстировкой системы.